

□ 解析・分析

各種 観察・測定・加工サービスを提供しております

SPM関連		非破壊検査・故障解析	
広がり抵抗測定法	SRA	X線CT法	
走査型静電容量顕微鏡法	SCM	超音波顕微鏡法	C-SAM
走査型非線形誘電率顕微鏡法	SNDM	エミッショングラフィー	EMS
走査型マイクロ波顕微鏡法	SMM	光ビーム加熱抵抗変動法	OBIRCH
走査型広がり抵抗顕微鏡法	SSRM	ロツクイン発熱解析法	
原子間力顕微鏡法	AFM		
磁気力顕微鏡法	MFM		

そのほかの測定法		加工法・処理法	
白色干渉計測定法		集束イオンビーム加工	FIB
全有機体炭素測定	TOC	Arイオンミリング加工	
カールフィッシャー滴定法		ウルトラミクロトーム加工	
示差熱天秤-質量分析法	TG-DTA-MS	Arイオン研磨加工	IP法
フォトルミネッセンス法	PL	基板側からの測定用加工	SSDP用加工
絶対PL量子収率測定		雰囲気制御下での処理	
紫外可視分光法	UV-Vis	レーザー加工	

